

日にち	時間		タイトル	講師	所属
12/5(火)	10:00-11:20	1	各手法共通－分析試料の前処理と取り付けに関する指針 (JIS K 0154:2017, ISO 18116:2005) 各手法共通－分析前の試料の取り扱い (ISO 18117:2009) – 正しい結果を得るための試料の取り扱い－	山内 康生	矢崎総業
	11:20-12:40	2	AES & XPS－空間分解能の決定 (ISO 18516:2019) AES & XPS－空間分解能, 分析領域及び分析器から見える試料表面領域の決定 (ISO/TR 19319:2013) －空間分解能と分析領域を知るために－	齋藤 健	サーモフィッシャー サイエンティフィック
	12:40-13:40		昼食		
	13:40-15:00	3	XPS－薄膜分析の結果報告 (ISO 13424:2013) – 正しい薄膜分析－	松村 純宏	ウエスタンデジタル テクノロジーズ
	15:00-16:20	4	AES & XPS－均質物質定量分析のための実験的に求められた相対感度係数の使用指針 (JIS K 0167:2011, ISO18118:2015) －均質物質の正しい定量分析－	永富 隆清	旭化成
	16:20-16:30		休憩		
	16:30-17:00		質疑応答		
12/6(水)	10:00-11:20	5	SIMS－S-SIMSにおける相対強度軸目盛の繰り返し性と恒常性 (ISO 23830:2008) SIMS－単一イオン計数飛行時間型分析器の強度スケールの線形性 (ISO17862:2013) －正しい2次イオン強度計測のために－	飯田 真一	アルバック・ファイ
	11:20-12:40	6	SIMS－ToF-SIMSにおける質量軸校正 (ISO 13084:2018) －正しい二次イオン質量を得るために－	伊藤 博人	コニカミノルタ
	12:40-13:40		昼食		
	13:40-14:40	7	XPS－帯電制御と帯電補正に用いた手法の報告方法 (ISO 19318:2021) －絶縁物の正しいXPS分析－	高野 みどり	パナソニック インダストリー
	14:40-15:40	8	AES－帯電制御と帯電補正に用いた手法の報告方法 (ISO 29081:2010) －絶縁物の正しいAES分析－	荒木 祥和	日産アーク
	15:40-15:50		休憩		
	15:50-16:30		帯電制御のための試料取り付け実習	高野/荒木	
	16:30-17:00		全体討議		